Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 3

|  |  |
| --- | --- |
| **LP**  **.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Czytnik mikropłytek ELISA** |
| 1. | Odczyt płytek 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384-dołkowych płasko- i okrągłodennych |
| 2. | Zakres długości fali w zakresie co najmniej 340 - 750 nm |
| 3. | Pomiar absorbancji:   1. w zakresie co najmniej 0,0 – 4,0 2. dokładność nie gorsza niż ±1% przy OD 2 dla długości fali 405 nm 3. liniowość nie gorsza niż ±1% przy OD 2 dla długości fali 405 nm 4. powtarzalność nie gorsza niż ±0,5% przy OD 2 dla długości fali 405 nm |
| 4. | Czas odczytu całej płytki 96-dołkowej nie dłuższy niż 25 s |
| 5. | Filtry optyczne:   1. 340 nm 2. 405 nm 3. 450 nm 4. 595 nm 5. 650 nm |
| 6. | Funkcja autotestu podczas uruchomienia urządzenia |
| 7. | Certyfikat do diagnostyki in-vitro (CE-IVD) |
| 8. | Pamięć wewnętrzna na co najmniej 40 programowalnych protokołów |
| 9. | Funkcja szybkiego odczytu |
| 10. | Funkcja wytrząsania z regulacją intensywności |
| 11. | Kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 4,3” |
| 12. | Sterowanie:   1. z poziomu panelu dotykowego 2. za pomocą komputera |
| 13. | Port USB – co najmniej 3 szt. |
| 14. | Zasilanie 230V/50Hz |
| 15. | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |
| **II.** | **Oprogramowanie do czytnika płytek co najmniej 5 licencji** |
| 1. | Sterowanie czytnikiem płytek |
| 2. | Pamięć wewnętrzna na co najmniej 20 edytowalnych protokołów programowalnych przez użytkownika |
| 3. | Przetwarzanie wyników:   1. Transformacje 2. Cut-offs |
| 4. | Konfigurowanie raportu |
| 5. | Eksport do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego |